排ガス浄化触媒材料 CeO₂-ZrO₂-Y₂O₃の結晶構造とイオン伝導経路

<u>脇田崇弘</u>^{a,b},八島正知^b,河内勝浩^a,植田俊和^b,小松隆史^b ^a第一稀元素化学工業(株),^b東京工業大学

<u>緒言</u>

CeO₂、CeO₂-ZrO₂やCeO₂-ZrO₂-Y₂O₃材料は、 自動車排ガス浄化の助触媒として利用されて おり研究も盛んに行われている[1-3]。CeO₂ -ZrO₂固溶体の結晶構造については、八島ら [4-8]によって研究されており準安定正方相 である t'や t"相の存在、これらの空間群が P4₂/nmc に帰属されることなどが報告されて いる。しかしながら、CeO₂-ZrO₂-Y₂O₃固溶体 の結晶構造と電子密度分布については検討さ れていない。そこで本研究はCe_{0.25}Zr_{0.5}Y_{0.25}O_{1.85} 固溶体の 1000 K での放射光回折データのリ ートベルト解析を行い、結晶構造を精密化し た。さらに、酸素イオンの伝導経路を検討し、 同じ結晶構造を持つ CeO₂ と比較したので報 告する。

<u>実験</u>

SPring-8に設置されている放射光X線回折 装置BL-02B2にて1000 KでCe_{0.25}Zr_{0.5}Y_{0.25}O_{1.85} およびCeO₂の放射光X線回折プロファイルを その場測定した。得られたデータはプログラ ムRIETAN-2000[9]を用いてリートベルト解 析を行い、結晶構造を精密化した。電子密度 分布は最大エントロピー法 (MEM) 及びMEM に基づいたパターンフィッティングにより解 析した。これらの計算はプログラムPRIMA[10,11] を用いて行った。

<u>結果と考察</u>

Fig.1 に 1000 K における Ce_{0.25}Zr_{0.5}Y_{0.25}O_{1.85} と CeO₂の放射光 X 線回折プロファイルを示 す。空間群 *Fm*3*m*を仮定してリートベルト解 析を行った。



Fig.1 Rietveld fitting patterns for neutron-diffraction data of the (a) $Ce_{0.25}Zr_{0.5}Y_{0.25}O_{1.85}$ and (b) CeO_2 solid solution measured at 1000 K.

その結果、 $Ce_{0.25}Zr_{0.5}Y_{0.25}O_{1.85}$ および CeO_2 の格 子 定 数 は そ れ ぞ れ a = 5.32333(8) Å お よ び 5.48828(7) Å、等方性原子変位パラメーターは陽 イオンがそれぞれ 0.0241(11) Å² および 0.0112(3) Å²、O 原子がそれぞれ 0.0929(14) Å² および 0.0263(8) Å² のように精密化された(信頼度因子 はそれぞれ $R_{wp}=1.71\%$ および $R_{wp}=6.27\%$ であっ た)。これは、 $Ce_{0.25}Zr_{0.5}Y_{0.25}O_{1.85}$ の酸素イオン は CeO_2 よりも高い拡散性を有していることを示 唆している。

Fig.2 に 1000 K における Ce_{0.25}Zr_{0.5}Y_{0.25}O_{1.85}と CeO₂の(110)面における電子密度分布を示す。また、可能性のある伝導経路を破線で示した(Fig.2)。



Fig.2 Electron density on (110) plane of (a) $Ce_{0.25}Zr_{0.5}Y_{0.25}O_{1.85}$ with black contours in the range from 0.85 to 5.0 Å⁻³ (0.2 Å⁻³ step) and (b)CeO₂ with black contours in the range from 0.3 to 5.0 Å⁻³ (0.2 Å⁻³ step) measured at 1000 K.

この結果より、Ce_{0.25}Zr_{0.5}Y_{0.25}O_{1.85}とCeO₂の酸 素イオンは<100>方向に沿って拡散することが 示唆された。しかしながら、CeO₂の伝導経路は 曲がっているのに対し、Ce_{0.25}Zr_{0.5}Y_{0.25}O_{1.85}の伝導 経路は直線のような経路になることがわかった。 この違いはZrまたはYの添加による陽イオンと 酸素イオンとの間の反発が異なるためと考察し た。

参考文献

- [1]. H.C. Yao, Y.F. Yao, J. Catal., 86, 157(1984).
- [2]. M. Ozawa, M. Kimura, A. Isogai, *J. Alloys Comp.*, **193**, 73(1993).

[3]. Y. Sakamoto, K. Kizaki, T. Motohiro, Y. Yokota, H. Sobukawa, M. Uenishi, H. Tanaka, M. Sugiura, *J. Catal.*, **211**, 157(2002).

[4]. M. Yashima, K. Morimoto, N. Ishizawa, M. Yoshimura, *J. Am. Ceram. Soc.*, **76**, 1745(1993a).

[5]. M. Yashima, K. Morimoto, N. Ishizawa, M. Yoshimura, *J.Am. Ceram. Soc.*, **76**, 2865(1993b).

[6]. M. Yashima, H. Arashi, M. Kakihana, M. Yoshimura, *J. Am. Ceram. Soc.*, **77**, 1067(1994a).

[7]. M. Yashima, H. Takashina, M. Kakihana, M. Yoshimura, *J. Am. Ceram. Soc.*, **77**, 1869(1994b).

[8]. M. Yashima, S. Sasaki, Y. Yamaguchi, M. Kakihana, M. Yoshimura, T. Mori, *Appl. Phys. Lett.*, **72**, 182(1998).

[9]. F. Izumi, T. Ikeda, *Mater. Sci. Forum*, **321–324**, 198(2000).

[10]. F. Izumi, R. A. Dilanian, *in Recent Research Developments in Physics*, Transworld Research Network, Trivandrum, **Vol. 3**, Part II, 699(2002).

[11]. K. Momma, F. Izumi, *Commission on crystallogr. Comput., IUCr Newslett.*, No 7, 106(2006).